

десятков нм. Через определ. промежутки времени проводят рентгеноэлектронный анализ поверхности и получают зависимость интенсивностей определ. линий от времени травления (или от глубины, если известна скорость травления). Т. о. можно проводить послойный анализ на глубину до неск. мкм. Используя зависимость интенсивности линий фотоэлектронного спектра от угла α , определяют изменения состава образца по глубине до 10 нм без его разрушения.

Р. с.—единств. метод, позволяющий определить толщину d и качество монокристаллич. плёнок толщиной 0,5—3,0 нм. Метод основан на экспоненц. зависимости I от d и α :

$$I_{A(d)} = I_{A(0)} \exp(-d/\lambda \sin\alpha),$$

где $I_{A(d)}$ и $I_{A(0)}$ — интенсивности линий элемента А соответственно при наличии на подложке плёнки толщиной d и без неё; λ — длина свободного пробега фотоэлектронов в плёнке. Для расчёта d достаточно измерить $I_{A(d)}$, при двух разл. значениях угла α .

Вследствие дифракции фотоэлектронов адсорбиров. молекулы на атомах адсорбента-монокристалла интенсивность рентгеноэлектронного спектра зависит от углов между потоком фотоэлектронов и разл. направлениями в монокристалле. Эта зависимость позволяет определить способ координации адсорбиров. молекулы.

Лит.: Немошакаленко В. В., Аleshin V. G., Электронная спектроскопия кристаллов, 2 изд., К., 1983; Миначев X. M., Антошин Г. В., Шпиро Е. С., Фотоэлектронная спектроскопия и ее применение в катализе, М., 1981; Недедов В. И., Черепин В. Т., Физические методы исследования поверхности твёрдых тел, М., 1983; Недедов В. И., Рентгеноэлектронная спектроскопия химических соединений, М., 1984.

РЕНТГЕНОЭМУЛЬСИОННАЯ КАМЕРА — координатный детектор частиц высоких энергий, позволяющий определить энергию частицы ($\epsilon > 1-2$ ТэВ) и параметры её траектории, используя образование в плотной среде электронно-фотонных каскадов. Последние развиваются в результате процессов тормозного излучения и образования электрон-позитронных пар (см. Электронно-фотонные линии).

Электронно-фотонные каскады регистрируются по суммарному фотогр. действию пучка каскадных электронов на рентг. плёнку, помещённую на нек-рой глубине t в плотном поглотителе (обычно Pb или Fe). При достаточно большой энергии первичной частицы ϵ_0 и достаточной степени развития каскада число каскадных электронов N на глубине t бывает столь велико (рис. 1), что вызванное ими скрытое изображение после проявления даёт пятно потемнения,

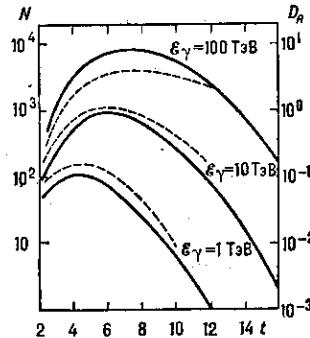


Рис. 1. Каскадные кривые: зависимость числа частиц N (сплошные линии, левая шкала) и интегрального потемнения D_R (штриховые линии, правая шкала) в круге радиуса $R = 50$ мкм от глубины t в свинцовом поглотителе для разных значений энергии γ -кванта ϵ_γ .

видимое невооруж. глазом. Размеры пятна определяют и пространственную разрешающую способность Р. к. для регистрации отд. частиц, к-рая в ср. ~100 мкм. Видимое пятно потемнения позволяет не только легко обнаружить место прохождения частицы, но и определить ϵ_0 фотометрированием, т. к. степень его потемнения зависит от числа каскадных электронов, а следовательно и от величины ϵ_0 .

Количественной мерой потемнения при фотометрировании служит величина $D = \lg I_0/I$, где I_0 и I — ин-

тенсивности светового пучка, проходящего через диафрагму фотометра без пятна потемнения и с ним. Существует неск. методов определения энергии ϵ_0 по фотометрич. измерениям. Наиб. широко используется интегральное потемнение $D_R(\epsilon_0, t)$ на глубине t , измеренное с помощью круговой диафрагмы радиуса R (иногда применяются диафрагмы с прямоуг. щелью). Связь между D_R и ϵ_0 определяется свойствами эмульсии, к-рые характеризуются кривой почернения $D(n)$ — зависимостью потемнения малого элемента плохади от плотности n электронов, прошедших через этот элемент, и пространственным распределением плотности электронов $n(\epsilon_0, t, r, \varphi)$ в каскаде на глубине t (r — расстояние от оси каскада, φ — азимутальный угол в плоскости, перпендикулярной оси каскада). Интегральное потемнение D_R при вертикальном падении равно:

$$D_R(\epsilon_0, t) = -\lg \left\{ \frac{1}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \exp\{-\ln 10 D(n(\epsilon_0, t, r, \varphi))\} \times \right. \\ \left. \times r dr d\varphi \right\}. \quad (*)$$

Для определения ϵ_0 эксперим. значения D_R сопоставляются с вычисленными по ф-ле (*), в к-рой $n(\epsilon_0, t, r, \varphi)$ рассчитывается теоретически, а кривая почернения аппроксимируется ф-цией $D(n) = D_{\max} [1 - \exp(-ns)]$, где s — эф. площадь зерна эмульсии, D_{\max} — макс. потемнение, до к-рого может быть засвеченна плёнка (при бесконечно большой экспозиции). Т. к. с ростом n при переходе к области насыщения погрешность определения n , а следовательно, и ϵ_0 резко возрастают, для расширения диапазона измеряемых энергий иногда используют одновременно рентг. плёнки двух типов — большой (1) и малой (2) чувствительности (рис. 2).

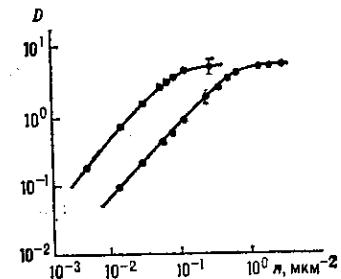


Рис. 2. Кривые почернения для рентгеновских плёнок РТ-6М (верхняя кривая) и РТ-СШ (нижняя).

В случае $\epsilon_0 \geq 10$ ТэВ при вычислении $n(\epsilon_0, t, r, \varphi)$ следует учитывать влияние многократного рассеяния на сечение осн. процессов (тормозное излучение, образование электрон-позитронных пар), ответственных за развитие каскада в области больших энергий (эффект Ландау — Померанчука — Мигдала). Использование рентг. плёнок для количественных измерений требует введения поправок, учитывающих конструкцию реальных Р. к., слоистость поглотителей, воздушный зазор между Pb и фотомультицилером и др. Точность определения энергии частиц Р. к. ~15—50%.

Р. к. помимо энергии частицы позволяет определить угол падения каскада. Рентг. плёнка покрыта с двух сторон слоями эмульсий, разделёнными расстоянием 200—250 мкм, поэтому угол падения можно определить по относит. смещению пятен в эмульсионных слоях. Возможно и использование двух разл. плёнок, разделённых нек-рым промежутком с точным фиксированием их взаимного расположения. Точность измерения зенитного угла ~3° и азимутального φ~15°.

Наряду с интегральным потемнением D_R для определения ϵ_0 используют сканирование области потемнения фотометрич. ячейкой малого размера с последующей обработкой сканограммы на ЭВМ.